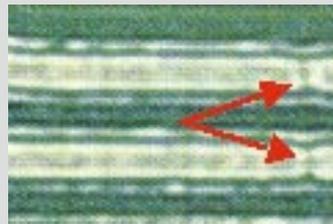


【原因・判断ポイント・発生工程】ネガタイプ A W F の透明部が汚れていた為に出来たもの（露光焼付～E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】在负像 AWF 的透明部位被玷污而发生的（曝光～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Caused by a dirty transparent area of a negative image phototool (Imaging – etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 175

【注釋】
显微镜倍率 × 175

【Comments】
Magnification: ×175

1-2-2-7 合せズレランド欠け／錯位的焊环缺口 / Hole break-out by misalignment

【特徴】ビアホールやスルーホール穴とランドの位置がずれてリング状のランドが切れている状態の欠け。複数のランドが同一方向に欠けているのが特徴

【特征】导通孔或者镀通孔与焊环错位，焊环断裂的环形缺口，其特点是多个焊环在同一个方向发生缺口。

【Characteristics】Annular ring breaks-out due to the hole-to-land misalignment of a via hole or a component hole. Annular ring of two or more lands are shifted in the same direction.

【原因・判断ポイント・発生工程】露光焼付け工程で A W F と穴位置との合わせが悪かったり、A W F の伸び縮み等により、穴とランドの相対位置がずれて出来たもの（露光焼付～E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】在曝光工序 AWF 与孔对位不准、或者 AWF 伸缩等，致使孔与焊环的相对位置偏移而引起的（曝光～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by misalignment of a phototool to a hole, or elongation or shrinkage of a phototool. (Imaging – etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

1-2-2-8 回路ギザ／锯齿的线路 / Rough edged conductor

【特徴】回路線エッジがギザギザに食われている状態の欠陥

【特征】线路的边缘被腐蚀成为锯齿状的缺陷。

【Characteristics】A conductor is roughly etched.



【コメント】
顕微鏡倍率 × 50

【注釋】
显微镜倍率 × 50

【Comments】
Magnification: ×50